

新製品ニュース（表面欠陥検査装置）

New Wire Inspector が誕生しました。

「より小さい欠陥」を「より速く検出」するを実現しました。



検査対象寸法

$\phi 0.1 \sim \phi 1.3$ （検出部交換にて対応）

<どこが良くなった？>

投光 $\times 1$ 受光 $\times 2$ の構成（標準）の他に

投光 $\times 2$ 受光 $\times 4$ の2倍の構成ができます。

検出速度が単純に 2倍 となった。

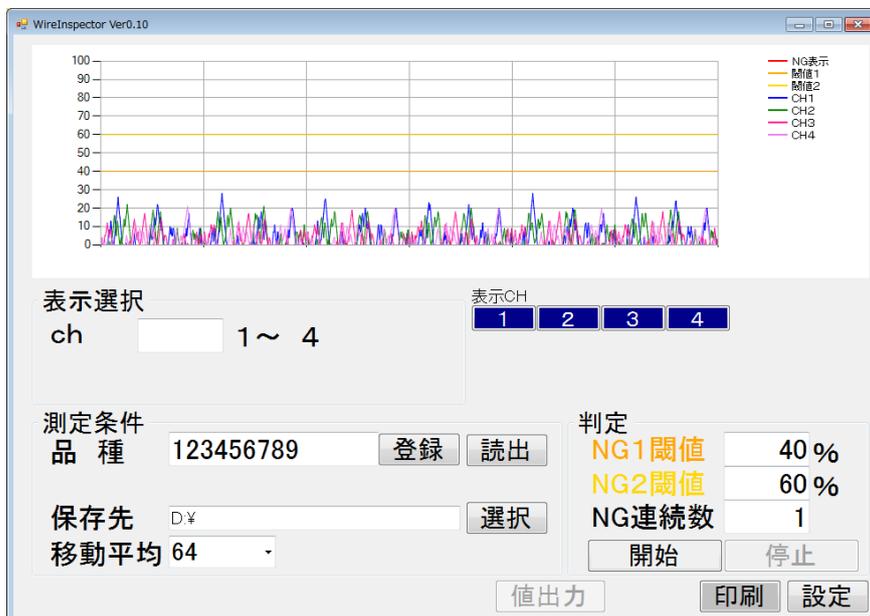
現行機種 10 m/min \rightarrow 20 m/min（計算値）に向上

データサンプリング を、3倍の周期にて実施。

より細かな欠陥を検出する。

新製品ニュース（表面欠陥検査装置）

モニタ画面（検出ヘッド 4ch仕様）

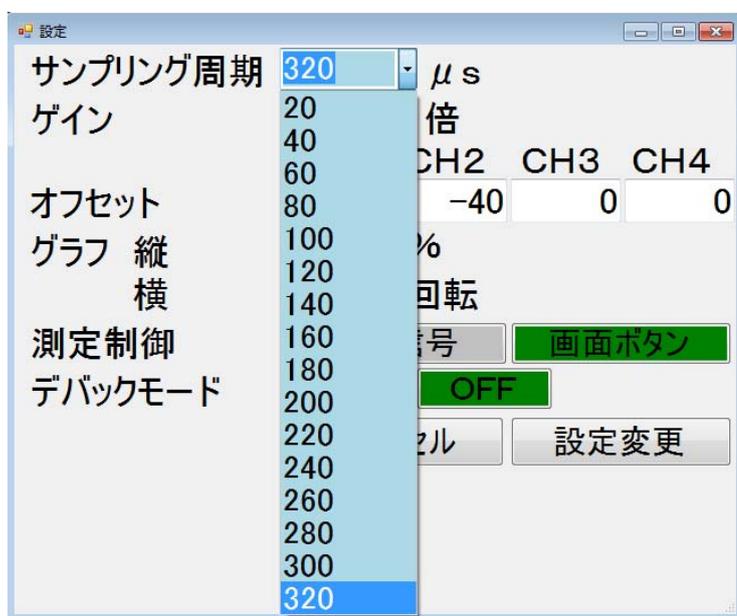


<どこが良くなった？>

品種毎にNGデータが自動保存される。

保存先も指定でき、測定結果の保存、解析、評価が容易になった。

パラメータ設定画面



<どこが良くなった？>

受光素子のゲイン、オフセットの遠隔操作ができ、対象材に対する最適条件を容易に設定できる。